

I-A233

## 超音波による欠陥形状の再構成

東海大学 大学院 学生員 横井 浩司  
 東北大工学部 正員 北原 道弘  
 岡山大学 環境理工学部 正員 廣瀬 壮一

## 1. はじめに

超音波を用いて、構造材料内部に存在する欠陥形状の再構成を行うことを目的とする。手法の要点は、欠陥による散乱波の積分表現に2種類の近似を導入し、この積分表現を散乱波の形状を表す特性関数のフーリエ変換像と相似な形に変換することにより、散乱波の計測から散乱体の形状を再構成することにある。ここではモデル実験を行って、計測散乱波形から円形空洞と楕円形空洞の形状の再構成を行い、手法の妥当性を検証する。

## 2. 弾性散乱場の積分表現

領域 $D$ 内に欠陥 $D^c$ が存在する場合を考えると、領域 $D$ 内の点 $\mathbf{y}$ における散乱波 $u_m^{sc}(=u_m - u_m^0)$ は次のように積分形で表現できる。

$$u_m^{sc}(\mathbf{y}) = \int_D G_{im}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) q_i(\mathbf{x}) dV \quad (1)$$

ここで、 $G_{im}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ は無限弾性体内のグリーン関数である。 $q_i(\mathbf{x})$ は等価散乱源で、欠陥形状に関する情報を含んでいる。この等価散乱源は、領域型と境界型のどちらでも定式化が可能であり、それ各自的形状は次のような形になる。

$$q_i(\mathbf{x}) = \Gamma(\mathbf{x}) \{ \delta\rho\omega^2 u_i(\mathbf{x}) - \delta C_{ijkl} u_{k,l}(\mathbf{x}) \partial/\partial x_j \} \quad (2)$$

$$q_i(\mathbf{x}) = -\gamma(\mathbf{x}) C_{ijkl} \{ n_j(\mathbf{x}) u_{k,l}(\mathbf{x}) - n_l(\mathbf{x}) u_k(\mathbf{x}) \partial/\partial x_j \} \quad (3)$$

$\Gamma$ は散乱体の内部でのみ値を有する特性関数、 $\gamma$ は散乱体の境界 $S$ 上にのみ値を有する特異関数である[1]。

## 3. 散乱場の遠方表現

波動の観測点 $\mathbf{y}$ が遠方に位置するとき、式(1)の表現は縦波成分と横波成分に分離することができる。波動計測上、縦波を計測することにして、式(1)の遠方表現のうち縦波成分は次のような形になる。

$$u_m^{sc,far}(\mathbf{y}) = \sqrt{\frac{2}{\pi k_L |\mathbf{y}|}} e^{i(k_L |\mathbf{y}| - \pi/4)} A_m(\hat{\mathbf{y}}) \quad (4)$$

ここで $A_m$ は次のような縦波の散乱振幅である。

$$A_m(\hat{\mathbf{y}}) = \frac{i}{4\mu} \kappa^2 \hat{y}_i \hat{y}_m \int_D q_i(\mathbf{x}) e^{-ik_L \hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{x}} dV \quad (5)$$

ここで、 $\kappa = k_L/k_T$ とした。

## 4. 欠陥像の再構成手法

欠陥への入射波を次のような平面縦波と仮定する。

$$u^0(\mathbf{x}) = u^0 \hat{\mathbf{d}}^0 e^{ik^0 \hat{\mathbf{p}}^0 \cdot \mathbf{x}} \quad (6)$$

ここで、 $u^0$ は振幅、 $\hat{\mathbf{d}}^0$ は変位の偏向方向を表す単位ベクトル、 $k^0$ は入射波の波数、 $\hat{\mathbf{p}}^0$ は入射波の進行方向を表す単位ベクトルである。パルスエコー法に対応した縦波入射の場合、 $k^0 = k_L$ 、 $\hat{\mathbf{d}}^0 = \hat{\mathbf{p}}^0 = -\hat{\mathbf{y}}$ となる。

## 4.1 ポルン再構成

式(5)の等価散乱源 $q_i(\mathbf{x})$ の表現に領域型の式(2)を採用し、変位にはポルン近似を導入する。即ち、変位場 $u_i$ を入射波 $u_i^0$ で置き換える。このとき、式(5)は次のようになる。

$$A_m(k_L, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{iu^0 \hat{y}_m k_L^2}{2} \int_D \Gamma(\mathbf{x}) e^{-2ik_L \hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{x}} dV \quad (7)$$

上式右辺の体積積分は、 $\mathbf{K} = 2k_L \hat{\mathbf{y}}$ としたとき、特性関数 $\Gamma(\mathbf{x})$ の $\mathbf{K}$ -空間におけるフーリエ変換 $\tilde{\Gamma}(\mathbf{K})|_{\mathbf{K}=2k_L \hat{\mathbf{y}}}$ と見ることができる。このとき、特性関数 $\Gamma(\mathbf{x})$ は逆フーリエ変換により次のように求められる。

$$\Gamma(\mathbf{x}) = -\frac{2i}{\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{\hat{y}_m}{u^0 k_L^2} \times A_m(k_L, \hat{\mathbf{y}}) e^{2ik_L \hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{x}} k_L dk_L d\hat{\mathbf{y}} \quad (8)$$

## 4.2 キルヒホフ再構成

等価散乱源 $q_i(\mathbf{x})$ の表現に境界型の式(3)を採用し、境界上の変位場にはキルヒホフ近似を導入する。即ち、変位場を入射波と反射波(L,T)の和で置き換える。このとき、式(5)は次のようになる。

$$A_m(k_L, \hat{\mathbf{y}}) \propto \frac{-u^0 \hat{y}_m k_L}{2} \int_D \gamma_H(\mathbf{x}) e^{-2ik_L \hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{x}} dV \quad (9)$$

ポルン近似の場合と同様に $\mathbf{K} = 2k_L \hat{\mathbf{y}}$ とすると、上式の右辺は特異関数のフーリエ変換 $\tilde{\gamma}_H$ と見なすことができる。よって、特異関数 $\gamma_H$ は次のように逆フーリエ変換により再構成できる。

$$\gamma_H(\mathbf{x}) = -\frac{2}{\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{\hat{y}_m}{u^0 k_L} \times A_m(k_L, \hat{\mathbf{y}}) e^{2ik_L \hat{\mathbf{y}} \cdot \mathbf{x}} k_L dk_L d\hat{\mathbf{y}} \quad (10)$$

## 5. 欠陥像の再構成に関するモデル実験

## 5.1 実験概要

ここでは図1に示すような実験装置を用いてパルスエコー法で実験を行った。トランステューサーは、公称中心周波数が4MHzの広帯域型を用いた。

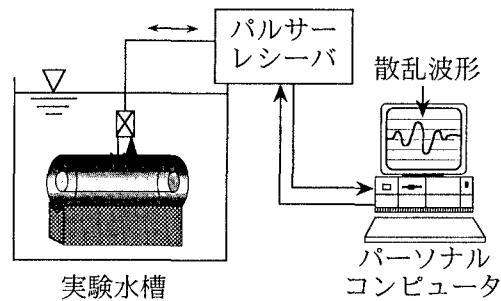


図1 実験装置

キーワード：線形化逆解析 超音波 形状再構成

〒424 静岡県清水市折戸3-20-1 TEL 0543-34-0411(ext. 2523) FAX 0543-34-9768

供試体として、図2(a)に示すような円柱形のアルミニウムの中心に直径10mmの円柱形の空洞を空けたものと、図2(b)に示すような中心に長径10mm、短径5mmの楕円形の空洞を空けたものを用いた。実験の際には供試体を回転させて、波動の入射方向を変化させた。また、供試体の空洞は水が入らないように空洞の両側をビニールテープで塞いである。

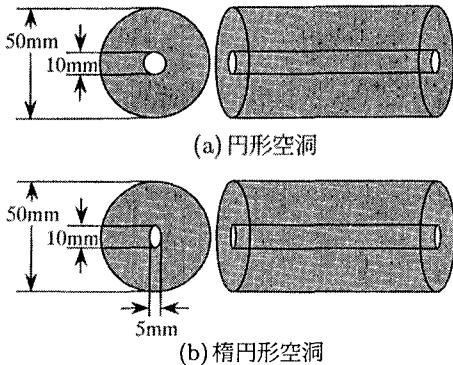
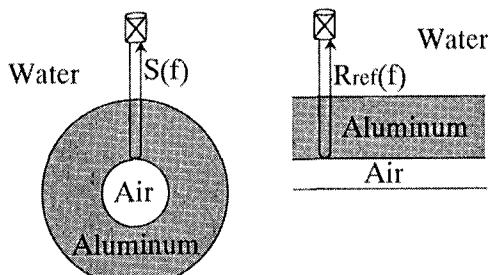


図2 モデル実験に用いた供試体

## 5.2 データ処理

図3(a)に示すように、アルミニウム内に存在する空洞からの散乱波を  $S(f)$  とする。ここで  $S(f)$  は実際に計測された時間域の散乱波形を FFT により周波数域に変換した波形である。また図3(b)に示すようなアルミニウム平板の底面からの反射波を参照波  $R_{ref}(f)$  として選定した。このとき、欠陥像の再構成表現式(8)と(10)におけるトランステューサー方向の散乱振幅  $A(f) = \hat{y}_m A_m$  は次のように書ける。

$$A(f) = \frac{S(f)}{R_{ref}(f)} \quad (11)$$

図3 計測散乱波  $S(f)$  と参照波  $R_{ref}(f)$ 

## 6. 計測波形による再構成結果

図4に実験による空洞の再構成結果を示す。式(11)に示した波形処理において、トランステューサーの帯域を考慮し、ここでは周波数帯域を0~6MHzの範囲で逆変換を行った。図4(a)が円形空洞の再構成結果、図4(b)が楕円形空洞の再構成結果である。半径(長径)を  $a$  とそれぞれ無次元化してある。両解析とも欠陥の形状がほぼ再現されていることがわかる。

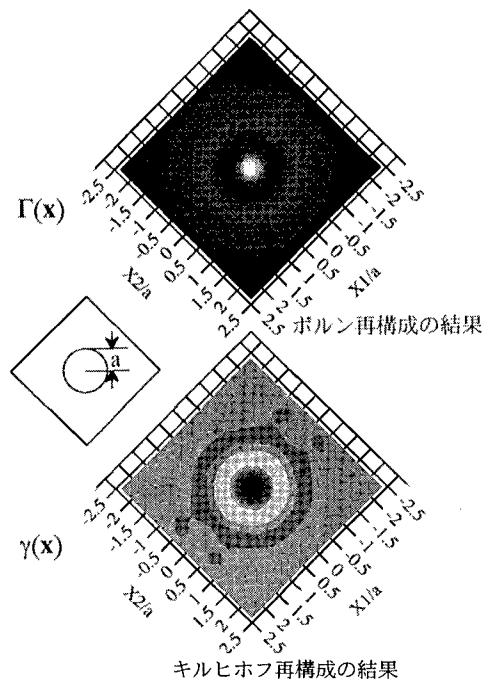


図4 (a) 円形空洞の再構成結果

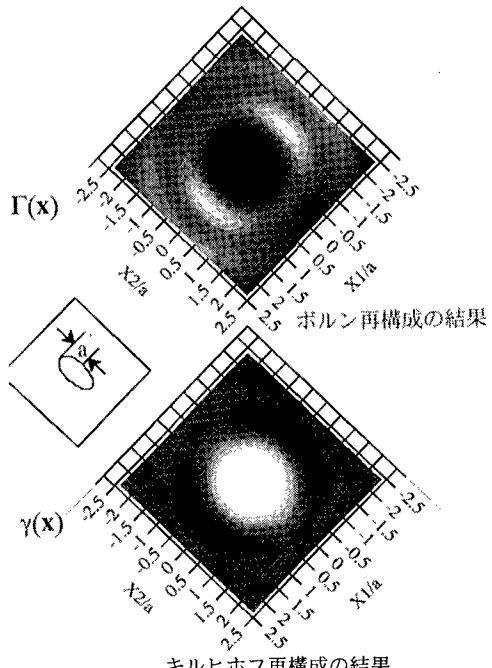


図4 (b) 楕円形空洞の再構成結果

## 参考文献

- [1] 横井, 北原, 廣瀬, 「線形化逆解析手法による欠陥形状の再構成」, 土木学会第51回年講概要集, 共通 pp.30-31, 1996.9